

无接触式硅片厚度、TTV、电阻率测量仪Dsi2000

产品名称	无接触式硅片厚度、TTV、电阻率测量仪Dsi2000
公司名称	上海双尔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区剑川路951号5幢2层A2039室
联系电话	021-34150813 13916690854

产品详情

本设备是一款手动无接触式测量仪，采用测量原理为电容法和涡流法，测量操作简单，强大的数据处理功能，支持多种格式的数据报告。

测量指标如下：硅片规格：方片:125x125mm、156x156mm
圆片:3、4、5、6、8 测试功能：厚度：单点及多点厚度
TTV：总厚度偏差 体电阻率：单点及多点体电阻率

厚度指标： 测量范围：150 μm-1000 μm(可调) 绝对偏差： ±1.0 μm
重复性：1 0.2 μm 长时间稳定性(10小时)：1 0.15 μm

TTV指标： 测量范围：0.0 μm-200 μm 偏差： ±0.5 μm
重复性：1 0.2 μm

电阻率指标： 测量范围：0.1 .cm-30 .cm 偏差： ±3%*R
重复性：1 1.5%*R

测试环境要求： 温度范围：15~27 湿度范围：35%~85%